

九州大学水素材料先端科学研究センター利用規程

平成 29 年度九大規程第 142 号

施行：平成 30 年 3 月 30 日

最終改正：令和 3 年 9 月 30 日

(令和 3 年度九大規程第 82 号)

(趣旨)

第 1 条 この規程は、九州大学水素材料先端科学研究センター（以下「センター」という。）の設備の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第 2 条 設備の利用を希望する者は、センターの長に申請し、その許可を得なければならない。

(利用者の義務)

第 3 条 設備を利用する者（以下「利用者」という。）は、センターの職員の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって設備を利用しなければならない。

(損害賠償)

第 4 条 利用者が、その責めに帰すべき事由により、設備等を滅失、破損又は汚損したときには、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用料)

第 5 条 利用者は、別表に掲げる利用料を支払わなければならない。ただし、センター長が特に必要と認めた場合は、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(徴収方法)

第 6 条 前条に規定する利用料は、経費の振替又は九州大学が指定する口座への振込みにより、所定の期日までに支払わなければならない。

2 既納の利用料は、原則として返還しない。

(雑則)

第 7 条 この規程に定めるもののほか、設備の利用に関し必要な事項は、センターの長が別に定める。

附 則

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。

附 則（平成 30 年度九大規程第 65 号）

この規程は、平成 30 年 11 月 1 日から施行する。

附 則（平成 30 年度九大規程第 144 号）

この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第 75 号）

この規程は、令和元年 10 月 1 日から施行する。

附 則（令和 2 年度九大規程第 30 号）

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

附 則（令和3年度九大規程第82号）

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別表（第5条関係）

設備等名	1時間当たりの利用料
1MPa 水素ガス中疲労試験機(室温～150℃)	990 円
温度制御式高圧曝露実験装置	2,400 円
大気中疲労試験機(室温)	750 円
大気中疲労試験機(-45～250℃)	2,700 円
大気中共振疲労試験機	1,100 円
SEM(JSM-6510A)	750 円
SEM(SU1510)	510 円
EBSD(JSM-7001F)	3,500 円
水素分析装置 TDS(Q-mass)	17,000 円
水素分析装置 TDA(ガスクロマトグラフ)	800 円
局所水素分析装置 SIMS(IMS-7f)	5,700 円
FIB(JIB-4500)	9,500 円
大気中疲労試験機(室温)	790 円
大気中引張試験機(オートグラフ)	1,800 円
120MPa 水素ガス中疲労試験機(-45～120℃)	15,000 円
120MPa 水素ガス中疲労試験機(-45～120℃)	14,000 円
99MPa 水素ガス中疲労試験機(室温)	13,000 円
140MPa 水素ガス中疲労試験機(室温～200℃)	20,000 円
120MPa 水素曝露装置(300℃)	1,300 円
140MPa 水素ガス中共振疲労試験機	5,600 円
120MPa 水素曝露装置(300℃)	1,800 円
ねじり疲労試験機	1,100 円
微小部 X 線応力測定装置(PSPC-RSF/KM)	1,600 円
X 線小角散乱測定装置(SAXS)	9,600 円
X 線広角散乱測定装置(WAXS)	9,500 円
フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)	9,600 円
原子間力顕微鏡(AFM)	55,000 円
1MPa 低圧温度調整機能付きチャンバー	12,000 円
温調引張試験機(オートグラフ)	55,000 円
常温引張試験機	4,800 円
圧力チャンバー付き引張試験機	16,000 円
ガス透過率測定装置(GTR)	790 円

ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)	6,900 円
熱機械分析装置 (TMA)	11,000 円
示差走査熱量測定装置 (DSC)	3,800 円
熱拡散率測定装置(LFA)	61,000 円
時間領域核磁気共鳴装置(パルス NMR)	1,100 円
動的粘弾性測定装置(DMA)	110 円
リサイクル分取液体クロマトグラフィー(HPLC)	32,000 円
ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC)	8,600 円
固体-溶液高分解能核磁気共鳴装置 (NMR)	7,300 円
水素量測定装置(TDA)	610 円
低温弾性回復試験機 (TR テスター)	230 円
二次元寸法変化測定装置	360 円
高圧曝露設備(HPC-I)	2,400 円
高圧曝露設備(HPC-II)	2,400 円
ブリスタ試験機	5,500 円
熱重量分析装置(TG/DTA)	4,400 円
マイクロスコープ	4,200 円
二軸引張試験機	1,400 円
硬度計	260 円
破壊定量装置(光透過システム)	1,200 円
破壊定量装置(高分解能タイプ)	2,400 円
誘電緩和装置(ソーラトロン)	13,000 円
誘電緩和装置 (LCR)	8,600 円
室温デマチャ試験機	610 円
温調デマチャ試験機	1,200 円
高圧ガス透過率測定装置	5,100 円
高圧ガス環境寸法計測装置	3,200 円
オージェ分光分析装置 (AES)	2,600 円
X線光電子分光分析装置 (XPS)	6,300 円
RAMAN 分光分析装置	2,600 円

設備等名	1 件当たりの利用料
昇温脱離分析装置 (TDS)	40,000 円
水素環境摩擦試験機	21,000 円

高高度摩擦試験機	3,300 円
高圧摩擦試験機	266,000 円
高圧曝露容器	225,000 円